

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和 7 年 7 月 16 日

国立大学法人東京農工大学長 千葉 一裕

◎調達機関番号 415 所在地番号 13

○第 5 号

1 調達内容

(1) 品目分類番号 24

(2) 導入計画物品

バイオ・ソフトマテリアル可視化電子顕微鏡システム 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期

令和 8 年 3 月以降

(5) 調達に必要とされる基本的な要件

原子レベルの分解能での構造解析および組成分析が可能で nm スケールの生物試料やソフトマテリアルを無染色で可視化することの可能な透過電子顕微鏡を導入する。

A 透過電子顕微鏡本体は、

- ・加速電圧 200 kV 以上で、0.1nm 以下の分解能を有すること。
- ・干渉性の高い電子銃を装備すること。
- ・収差補正器を装備すること。
- ・顕微鏡像に加えてナノビーム回折図形の取得が可能なこと。
- ・STEM 用位相板を装着可能なこと。
- ・試料汚染防止機構を装備すること。
- ・高傾斜像シリーズを取得して 3D 再構成が可能であること。

B エネルギー分散 X 線分析装置を装備すること。

C CMOS カメラを装備すること。

D 冷却水循環装置を装備すること。

E 以下の試料ホルダーを含むこと。

- ・800℃以上の高温観察用試料ホルダー
- ・液体窒素冷却低温ホルダー
- ・X 線分析用ホルダー

2 資料及びコメントの提供方法

上記 1 (2) の物品に関する一般的な参考資料及び同 (5) の要求要件等に関

するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提出期限 令和 7 年 8 月 18 日 (月) 17 時 00 分 (郵送の場合は必着のこと。)

(2) 提出先 〒184-8588 東京都小金井市中町 2-24-16

東京農工大学小金井地区事務部会計室 契約係長 佐久間 徹
電話 042-388-7005

3 説明書の交付

本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 令和 7 年 7 月 16 日から令和 7 年 8 月 18 日まで。

(2) 交付場所 上記 2 (2) に同じ、及び本学ホームページ。

4 説明会の開催

本公表に基づく導入説明会を開催する。

(1) 開催日時 令和 7 年 7 月 22 日 (火) 11 時 00 分

(2) 開催場所 東京農工大学工学府管理棟 3 階第 2 会議室

5 その他

この導入計画の詳細は、導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6 Summary

(1) Classification of the products to be procured: 24

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: Bio-soft material visualization electron microscope system 1 set

(3) Type of the procurement: Purchase

(4) Basic requirements of the procurement:

We will introduce a transmission electron microscope that can perform structural and compositional analysis at atomic resolution and visualize nm-scale biological and soft materials without staining. It must satisfy the following requirements:

A Transmission electron microscope

- Resolution must be 0.1 nm or less at an accelerating voltage of 200 kV.
- It must have a highly coherent electron gun.
- It must be equipped with an aberration corrector.
- It must be possible to acquire nanobeam diffraction (NBD) patterns in addition to microscope images.
- It must be possible to mount phase plate for STEM.

- It must be equipped with a mechanism to prevent sample contamination.
 - It must be equipped with a system that can acquire high-tilt image series for 3D reconstruction.
- B It must be equipped with an energy dispersive X-ray analyzer.
- C It must be equipped with a CMOS camera.
- D It must be equipped with a cooling water circulation system.
- E The system includes the following sample holders.
- A sample holder for high-temperature observation above 800°C
 - A Liquid nitrogen-cooled low-temperature holder
 - A holder for X-ray analysis
- (5) Time limit for the submission of the requested material: 17:00, August 18, 2025
- (6) Contact point for the notice: Toru Sakuma, Section Chief for Contract and Purchase Section, Accounting at Koganei Accounting Office, Tokyo University of Agriculture and Technology, 2-24-16 Naka-cho Koganei-shi, Tokyo 184-8588, Japan, TEL 042-388-7005